Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio electrónico de barrido por emisión de campo Schottky, 2500000x B2-01-35-163-7050

Código: B2-01-35-163-7050

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Especificaciones	B2-01-35-163-7020	B2-01-35-163-7032	B2-01-35-163-7050	
Resolución	3,9nm @20kV(SE) 4,5nm @20kV(BSE)	3nm @30kV(SE) 4nm @30kV(BSE) 8nm @3kV(SE)	1,0nm @15kV(SE) 1,5nm @1kV(SE) 0,8nm @30kV(STEM)	
Voltaje	0,5kV~20kV 30kV opcional	0,2kV~30kV	20V~ 30kV	
Aumento	1x~300,000x	1x~300,000x(película) 1x~1,000,000x(pantalla)	1x~ 2,500,000x	
Cañón de electrones	Filamento de tungsteno prealineado	Filamento de tungsteno prealineado	Cañón de electrones de emisión de campo Schottky, con desaceleración en cilindro, objetivo compuesto electromagnético, objetivo termostático refrigerado por agua	
Sistema de vacío	Vacío libre de aceite de control totalmente automático <5×10-4 Pa	Vacío libre de aceite de control totalmente automático <5×10-4 Pa Bajo vacío opcional 5~1000Pa	Vacío libre de aceite de control totalmente automático Cañón de electrones <9x10-8Pa Cámara de muestras <5x10-4Pa	
Bomba de vacío	Bomba mecánica×1, >200 L/min Bomba turbomolecular×1, > 240 L/S	Bomba mecánica×1, >200 L/min Bomba turbomolecular×1, > 240 L/S	Bomba mecánica×1, >6m3/h Bomba turbomolecular×1, > 240 L/S, Bomba iónica x2, >25L/s	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Platina de trabajo	Platina automática de 2 ejes, X:100 mm Y:100 mm	Platina automática de 5 ejes, X:120 mm Y:115 mm Z:50 mm T: -10° ~+90° R: 360° Opcional: platina automática de 3 ejes, B2-01-35-163-7032-A	Platina automática de 5 ejes, X:120 mm Y:115 mm Z:50 mm T: -10° ~+90° R: 360°	□
Cámara	CCD de navegación óptica vertical	CCD de navegación óptica vertical CCD de monitoreo horizontal	CCD de navegación óptica vertical CCD de monitoreo horizontal	□
Detector	Detector de electrones secundarios (ETD)	Detector de electrones secundarios (ETD)	Detector de electrones secundarios (ETD) Detector de electrones de ángulo alto Inlens	□
Software	Software de operación del SEM, idioma chino/inglés, visualización multicanal, navegación óptica, navegación por gestos, brillo y contraste automáticos, enfoque automático, astigmatismo automático, formato de imagen TIFF,JPG,BMP,PNG			□
Computador	Estación de trabajo, memoria 16G, disco duro 512G, monitor de 24", sistema Win10			□
Sala de instalación	Largo>3000 mm, ancho>4000mm, alto>2300 mm, temperatura 20~25 ℃, humedad<50%			□
Alimentación	CA 220 V(±10 %),50 Hz,2 kVA			□
□	Accesorios opcionales			N.º de catálogo
Opcional	BSE	BSE	BSE	B2-01-35-150-7051
	EDS	EDS	EDS	B2-01-35-150-7052
	-	EBSD	EBSD	B2-01-35-150-7053
	-	-	EDS+EBSD	B2-01-35-150-7054
	-	-	STEM, 9 cuadrantes, área total 80mm2	B2-01-35-150-7055
	-	-	EBIC	B2-01-35-150-7056
	-	-	CL	B2-01-35-150-7057
	-	-	Panel de control con perillas y trackball	B2-01-35-150-7058
	-	-	Almacén de intercambio de muestras	B2-01-35-150-7059
	-	-	Compuerta del haz y exposición por haz de electrones	B2-01-35-150-7060
	-	LVD, detector de bajo vacío	-	B2-01-35-150-7061
	-	Doble ánodo (emisión tetrodo)	-	B2-01-35-150-7062
	Filamento de tungsteno (6 unidades)	Filamento de tungsteno (6 unidades)	-	B2-01-35-150-7063
	Software de unión de imágenes de gran tamaño	Software de unión de imágenes de gran tamaño	Software de unión de imágenes de gran tamaño	B2-01-35-150-7070

● Alta resolución, imágenes de alta resolución con bajo voltaje de aceleración.

● Tecnología Super Tunnel de alta presión con electrones de alta energía en el túnel, que reduce el efecto de carga espacial y garantiza la resolución a bajo voltaje.

● La trayectoria óptico-electrónica no tiene cruce (crossover), lo que reduce eficazmente la aberración del sistema y mejora la capacidad de resolución.

● El objetivo compuesto electromagnético reduce las aberraciones, mejora notablemente la resolución a bajo voltaje y permite observar muestras magnéticas.

● El objetivo termostatizado con refrigeración por agua asegura la estabilidad, la confiabilidad y la repetibilidad de la lente objetivo.

● Diafragma ajustable de seis orificios con deflexión magnética y apertura de conmutación automática, sin ajuste mecánico, para cambiar rápidamente entre observación de alta resolución y modo de análisis con haz grande.

▶Bajo voltaje

En muestras de material de carbono, a bajo voltaje la profundidad de penetración es pequeña y se obtiene la morfología real de la superficie de la muestra, con más detalles.

En muestras de cabello, a bajo voltaje se reduce el daño por irradiación del haz de electrones y se elimina el efecto de carga.

▶Bajo vacío (opcional)

El material de los tubos de fibra de filtro tiene mala conductividad eléctrica y presenta una carga evidente en alto vacío. En bajo vacío, la muestra no conductora se puede observar directamente sin recubrimiento.

▶Funciones destacadas

Astigmatismo asistido inteligente

Refleja directamente el astigmatismo de todo el campo visual; con un clic del mouse se puede ajustar rápidamente el astigmatismo al óptimo.

Enfoque automático

Enfoque con un clic para una obtención de imágenes rápida.

Astigmatismo automático

Corrección de astigmatismo con un clic, que mejora la eficiencia.

Brillo y contraste automáticos

Brillo y contraste automáticos con un clic, para una imagen con un nivel de grises adecuado.

Imágenes con información múltiple simultánea

B2-01-35-163-7050 permite cambiar con un clic entre la imagen híbrida SE y BSE; la información de morfología y composición de las muestras puede observarse simultáneamente.

Rotación rápida de imagen

Al arrastrar una línea, la imagen se "angula" al instante.

▶Campo visual amplio

En muestras biológicas, la observación de campo amplio permite obtener fácilmente la morfología general y los detalles de la estructura de la cabeza de una mariquita, y mostrar análisis a distintas escalas.

Navegación rápida por gestos

Selección por recuadro y aumento: con la navegación de bajo aumento se obtiene un amplio campo visual de la muestra, lo que permite seleccionar con rapidez el área de interés y mejora la eficiencia del trabajo.

El microscopio electrónico de barrido no se limita a la observación de la morfología superficial, sino que también permite analizar los microcomponentes de la superficie de la muestra.

Además del detector convencional de electrones secundarios (ETD), el detector de electrones retrodispersados (BSED) y el espectrómetro de rayos X de energía dispersiva (EDS), se reservan muchas interfaces; por ejemplo, se pueden integrar en B2-01-35-163-7032 detectores de difracción de electrones retrodispersados (EBSD) y de cátodoluminiscencia (CL).

Detector de electrones retrodispersados de cuatro segmentos (BSE)

-- Imágenes multicanal

El detector tiene un diseño esmerado y alta sensibilidad. Adopta un diseño de 4 segmentos y permite obtener imágenes de sombras e imágenes de distribución de componentes en distintas direcciones sin inclinar la muestra

Imagen SE vs. imagen BSE

En el modo de imagen por electrones retrodispersados, el efecto de carga se debilita de forma evidente y se obtiene más información de composición de la superficie de la muestra

Instrumentos de preparación de muestras para microscopio electrónico de barrido		
B2-01-35-150-7038Máquina de fresado (pulido), grabado y pulverización por haz de iones	**B2-01-35-150-7039Máquina de grabado, pulido y adelgazamiento por haz de iones**	**B2-01-35-150-7080Ultramicrótomo**

Imágenes				
Código de modelo	**B2-01-35-163-7050**			
Otras especificaciones	Bomba turbomolecular 240L/S, bomba mecánica 12m3/H			
Accesorio opcional	B2-01-35-150-7001 BSE B2-01-35-150-7002 EDS B2-01-35-150-7011 Recubridor iónico por pulverización catódica			
Sistema compatible	Win10			
Luz transmitida	Cartucho de filamento de tungsteno, voltaje 1~30KV			

Platina de trabajo	Platina manual de 3 ejes X/Y/R, diámetro máx. de muestra 370mm, altura máx. 68mm			
Desplazamiento de la platina de trabajo	100x100x60mm			
Tamaño de la platina de trabajo	Platina automática estándar de 3 ejes			
Tipo de platina de trabajo	Platina motorizada			
Objetivo	Detector SE+CCD			
Aumento estándar	1x~300000x			
Características	Platina motorizada			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

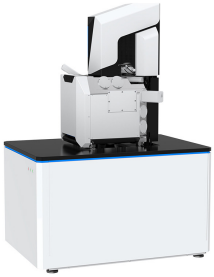


Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización